
**Surface chemical analysis —
Secondary ion mass spectrometry
— Method for determining yield
volume in argon cluster sputter depth
profiling of organic materials**

*Analyse chimique des surfaces — Spectrométrie de masse des ions
secondaires — Méthode de détermination du rendement volumique
dans le cadre du profilage en profondeur de matériaux organiques
par pulvérisation d'argon en grappe*



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn